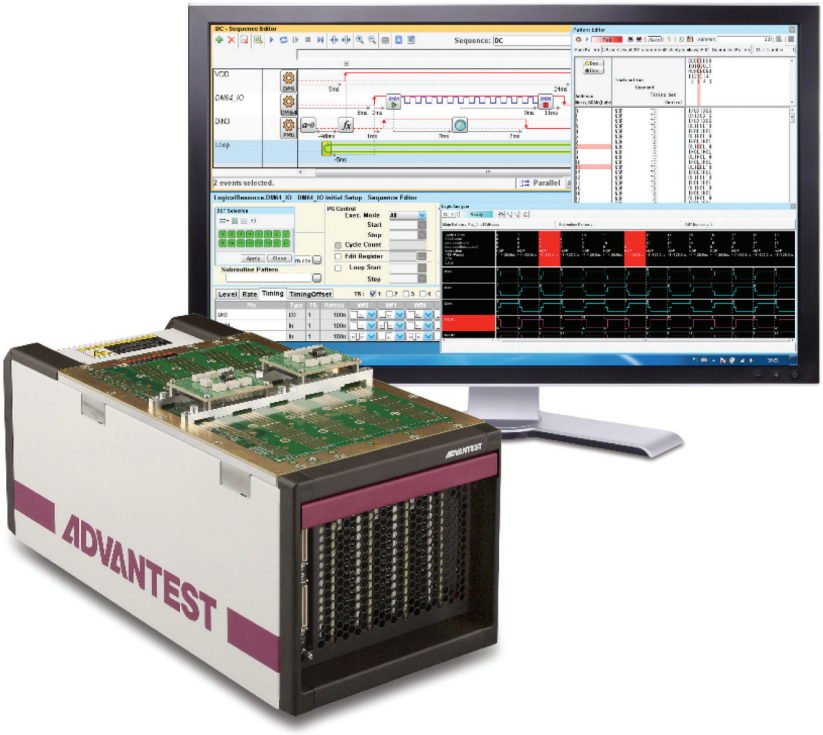
ADVANTEST

Digital Solution from R&D to Production

計測システム　EVA100



評価から量産までをこのシステム１台で

EVA100 Digital Solutionが

タイムリーなお客様の製品市場投入に貢献します

- パーソナル：デジタルICテストに必要な機能を卓上サイズに集約しました。
- 高精度：高精度タイミング同期と再現性で評価効率を向上させます。
- 直感的：プログラミング技術習得の時間が不要。デバイス評価に集中できます。
- 拡張性：テスティング・ユニットの連結により、最大1,024 CHまで対応できます。

IoT用途やSiPなどの複合化/多様化されたデバイスは、
テストコストを抑えつつも多品種をタイムリーに立ち上げる必要があります。
EVA100 Digital Solutionは、このようなご要望に対して最適に設計されています。

■ デジタルICの評価を卓上システムで実現

- 従来の(EVA100)比約60%の体積にスリム化
- デジタルIC評価に必要な計測機能を搭載
- デジタルIC評価に必要なソフトウエアを標準搭載
- 必要に応じて、外部計測器との同期制御が可能

主要機能

■ システム・モジュール

- モジュール/テスティング・ユニット間同期制御機能
- ユーティリティ電源
- リレー制御信号、I2Cバス、外部トリガ

■ 汎用デジタル・アナログ・デバイス電源

- Digital I/O 64 ch Data Rate: 100MHz
- フリーランクロック (Double Clockモード)
- 128MWパターン・メモリ、SCANパターン
- フェイル解析メモリ、デジタル・キャプチャ・メモリ
- High Voltage Pin, Per Pin PMU, TMU
- 18-bit AWG/DGT, VRef
- デバイス電源 500mAxN (並列接続可能)
- サブ・デバイス電源(PDPS)

■ ソフトウェア (Measurement Atelier)

- パターン・エディタ、ロジック・アナライザ
- Shmooツール
- レポート・ジェネレータ (自動出力可)
- シーケンス・ガジェット (テスト・テンプレート)
- デバッグ・評価ツール・セット
- 生産ツール

主要スペック

■ 本体サイズ (テスティング・ユニット)

- (W) 220 mm X (D) 472 mm X (H) 206 mm

■ システム構成

- エンジニアリング 128 ch
- プロダクション 256 ch 、512 ch、768 ch、1,024 ch

■ 多種多様なデバイスと用途をサポート

- デジタルICだけでなく、ミクスドICも対応可能
- 開発・評価から量産まで同一システムで対応

対象デバイス

- IoT向けデバイス、MCU,DFT/BIST対応デバイス
- SiP/Module デバイス
- 小規模FPGA/ASIC、指紋認証IC、Touch controller

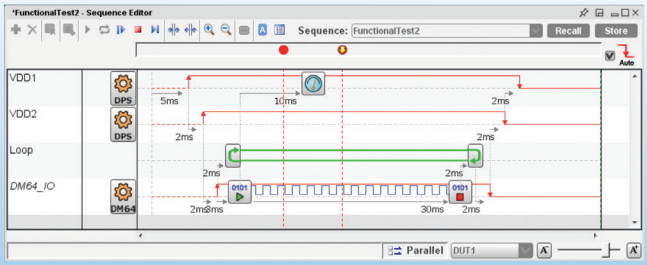
用途

- R&D評価
- ウェハ試験、パッケージ試験、DFT試験
- パッケージ評価、IP評価、不良解析
- System level test

■ 直感的な操作性でデバッグ効率を向上

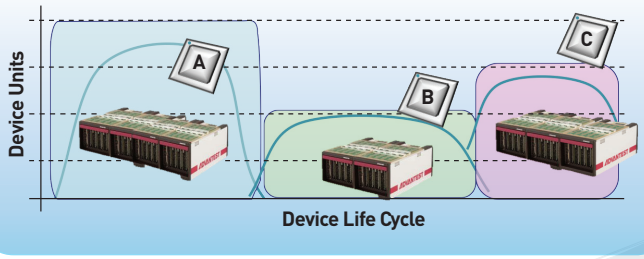
- 特別なプログラミング技術習得の時間が不要
- やりたいことがすぐできるGUIソフトウエア
- テンプレートの修正でテストシーケンスを簡単作成

Sequence Editor



■ テスティング・ユニットを連結し量産展開

- 簡単な組み換えで、生産量の変化や品種切り替えにも柔軟に対応



ADVANTEST

株式会社アドバンテスト
www.advantest.com

EVAプロジェクト E-mail:info_eva@advantest.com

© 2017 ADVANTEST CORPORATION

RL2017-002, Rev.J1